一种用于叶片散射光分布测定的新型装置及性能评价

劳彩莲^{1,2},李保国¹,郭 焱¹,严泰来²

(1. 中国农业大学资源与环境学院,教育部植物-土壤相互作用重点实验室,北京 100094;2 中国农业大学信息与电气工程学院,北京 100094)

摘 要:采用微功率激光管作为光源,围绕被测样品旋转的硅光电池作为检测器,研制了一种可以测定植物单个叶片反射 和透射光在入射面上分布的装置。分别在650 nm 和830 nm 波长光照条件下,测定了标准白板(参比样)的反射光和大叶黄 杨树叶的反射和透射在入射面上的光强分布。测定结果表明该装置有很好的重现性。所研制的装置可用于植物冠层光辐射 传输机理研究。

关键词:透射光;反射光;散射光分布;叶片;光辐射传输 中图分类号:S126 文献标识码:A 文章编号:1002-6819(2005)09-0085-05

劳彩莲, 李保国, 郭 焱, 等 一种用于叶片散射光分布测定的新型装置及性能评价[J] 农业工程学报, 2005, 21(9): 85-89. Lao Cailian, LiBaoguo, Guo Yan, et al Design and evaluation of a new device for measuring scattering light distribution of leaf[J] Transactions of the CSA E, 2005, 21(9): 85-89. (in Chinese with English abstract)

0 引 言

叶片作为植物冠层的主要组成元素,其光学特性特别是反射和透射光的分布特性的精确描述对于很多方面的研究都具有十分重要的意义。如在植物冠层的光分布研究和遥感冠层光谱定量分析中,需要基于叶片光学特性采用光辐射传输模型来模拟太阳光辐射在植物群体内的传输过程^[1-4]。在虚拟植物研究和自然景观设计中,植物的真实感显示是一项重要的研究课题^[5-6],而植物器官特别是叶片的反射光分布的精确描述,是植物真实感显示的重要基础。

常规的积分球测定方法可用于测定叶片的半球面 反射率和透射率,但不容易得到叶片的反射光和透射光 的空间分布。因此,在植物冠层的辐射传输模型研究中, 一般都假定叶片为bi-lam bertian 表面^[7]。但是,真实叶 片的反射光中包括漫反射和镜面反射两种分量,并且镜 面反射分量随着入射角的增大而增加^[8]。为了精确的模 拟叶片的散射光在植物冠层内的传输和分布,很有必要 对叶片的散射光(包括反射和透射)分布进行实际测量。

现有的表面散射光分布测量方法可以归纳为两大 类,它们的主要区别在于分布光强的检测方法不同。一 类是基于图像处理的测量方法^[9-11],主要用于可视化 研究。这类方法采用图像采集方式获得散射光分布,由 于不需要角度扫描,测量时间短,因而光源光强的变化 对其测量结果的影响小,测定结果比较稳定。但是,用于 图像采集的CCD 阵列的波长相应区间只在可见光范围

Email: libg@cau edu cn

内, 感光灵敏度也较低。因此, 只能用于反射光较强的可见光的散射分布测定, 对于一些在某些波段具有强选择性吸收的样品, 如叶片在可见光的蓝光、红光波段吸收 很强^[8], 则无法测出这些样品在这些波段的反射光强分 布。

另一类是直接测量方法,用独立的硅光电检测器检 测光强,通过硅光电检测器与被测物体二维的相对运 动,测定物体反射或透射光强的分布^[12]。这类方法采用 专用的光电传感器检测散射光强,检测器的响应波段区 间宽,检测灵敏度高。因此,研究人员通常用这类测量系 统测量叶片的散射光分布。但是,由于这类系统通过检 测器在物体表面的反射半球和透射半球二维扫描采集 散射光的分布光强时,扫描时间长达几个小时,因而测 定结果容易受光源强度波动的影响,重复性较差。

本文拟通过对直接测量方法进行改进,设计一个能 在较短的时间内(数分钟)完成单个叶片的反射光和透 射光在入射面上的光强分布测定的实验室测量装置。并 通过应用此装置对叶片在特征吸收波段和非特征吸收 波段的散射光分布特征的测定,评价该装置的性能。

1 原理

1.1 反射和透射光的散射特性

物体表面的反射可以分为镜面反射、方向反射和漫 反射三种类型。只有理想的光滑表面(如玻璃、金属表 面)会产生完全的镜面反射,相对于纳米级的波长来说 一般物体表面都可以看作粗糙表面。粗糙表面的反射光 呈现散射分布的特征,它是方向反射和漫反射两种分量 的线性组合。

方向反射是由粗糙表面上的微面元的镜面反射产 生的,其主要特征表现在反射光集中在镜面反射方向周 围的一个较小的角度范围内。当入射角较小时,反射峰 出现在镜面反射方向。随着入射角的增大,反射峰强度 也增大。当入射角接近90 掠入角时,反射峰强度陡增并

收稿日期: 2005-04-18 修订日期: 2005-05-26

基金项目: 国家 863 高技术研究发展计划资助项目(2003A A 209020) 作者简介: 劳彩莲(1966-), 女, 浙江慈溪人, 副教授, 主要从事生物 物理研究。北京 中国农业大学资源与环境学院, 100094。 Em ail: w ancf@ 263. net

通讯作者: 李保国(1964-), 男, 教授, 从事资源环境信息技术研究。 北京 中国农业大学资源与环境学院, 100094。

且反射峰出现的方向偏离镜面反射方向。而漫反射是由 粗糙表面对反射光的多级散射和射入物体表面的光被 物体内部颗粒的多次散射产生的,具有各向同性的特 点^[13,14]。物体的透射光可分为透明物体的规则透射和 非透明物体的漫透射两种类型。规则透射表现出折射的 特征,漫透射光是由物体内部颗粒对入射光的多级散射 产生的,和漫反射光类似,具有各向同性的特点。

1 2 反射和透射光空间分布的描述

光强的三维空间分布通常描述为球坐标下的高度 角 (θ) 和方位角(9) 的分布函数,物体的反射光或透射 光的光强分布可用反射半球和透射半球来描述,图 1 显 示了入射角(θ,9) 和反射角(θ,9) 的几何意义。图 1 中 的上半球代表反射半球,下半球代表透射半球。透射角 (θ,9) 的几何意义和反射角相同。



L-入射光 R-反射光 T-透射光 N-入射面法线 图1 入射角、反射角的球坐标表示

Fig 1 Representation of incidence and reflectance angle in sphere coordinates

1.3 反射和透射分布光强的检测原理

检测反射光和透射光的分布,实质上是检测反射半 球和透射半球上的各个方向的光强。本文中用检测角描 述检测方向。当检测到反射半球时,反射角为检测角;反 之,当检测到透射半球时,透射角为检测角。

采用直接测量的方法测量光强空间分布,需要通过 检测器与样品之间径向和纵向的相对转动来改变检测 角。入射角的调整同样需要光源与样品之间的二维转 动。

本研究只测定反射光(或透射光)在入射面上的分 布,因此入射角和检测角的 *Φ*角为 0 °,只需要调整入射 角 θ,检测角 θ(或 θ)。为提高测量可靠性能,我们将光 源固定,由样品做 θ方向的旋转改变入射角 θ。入射角 θ 设置以后,检测器围绕样品在入射面上做一维转动,即 可以测得入射面上各个反射(或透射光)方向的反射光 (或透射光)分布。

2 测量装置结构与工作流程

测量装置主要部件包括样品架、光源、检测器和电路单元等组件,图2显示了整个装置的结构示意图。整 套装置(PC 机除外)放置在一个封闭的暗箱里。

考虑到叶片散射光强较弱,需尽可能增加入射光强,以提高检测到的信号强度。因此,选用单色性好的微



图 2 叶片散射光分布测量装置结构图

Fig 2 Schematic representation of the device for the scattering light measurements of leaf

功率半导体激光管作为光源、光源的安装采用组件式设计,可以根据实验需更换不同波长的激光二极管作为光源。

处于中心位置的样品架可做径向 360 旋转, 由步进 电机SM 2 驱动。根据角度调整需要, 可对样品架进行径 向的 45 角范围内的调整。

检测单元主要由光电检测器、聚光镜和狭缝组成, 固定安装在一个内外壁经过发黑处理的金属光管中(称 为接收光管)。接收光管由步进电机 SM 1 驱动,可围绕 样品径向旋转 360 。进光狭缝安装在接收光管的前端, 狭缝尺寸可以调整,以改变检测角的分辨率。检测波段 范围为 350~1100 nm,可根据测量要求通过更换激光 管以改变光源波长。聚光镜和检测器安装在接收光管的 末端,聚光镜的焦平面落在检测器的检测面上。检测器 采用硅光电池,可受光面积为1 cm ×1 cm。

控制电路单元以微处理器为核心,控制光源的驱动 和强度调节,光电检测器输出信号的采集和步进单机的 驱动转动,以实现对反射和透射分布光强的自动扫描测 量。图3显示了进行一次扫描测量的控制流程。为便于 操作,编制了在PC机上运行的图形界面操作程序。该程 序的主要功能是通过与微处理器相连的RS-232口发 送测量参数以及系统校正、扫描测量命令,并对扫描的 光强角度分布数据进行动态显示和存贮。

3 测定结果与分析

叶片中的叶绿素在红光波段具有强烈的吸收,而在 近红外波段基本不吸收。本研究中分别选用了红光波段 中的650 nm 和红外波段830 nm 波长的光作为入射光, 测量叶片在这两个波长的反射和透射特征。

在以下的测量中,每个样品分别以0°30°60 外射 角下重复测量三次。测量一次反射(或透射)分布光强的 检测角扫描范围为180°扫描间隔为1°测量时间为42 min。



Fig 3 Flow chart of a complete scan of recordings

3.1 参比样的反射光分布测定

在反射光测定中,通常使用一种没有特征吸收的中 性标准物质作为参比,以消除光源等测量系统的波动对 测量结果的影响。本文中采用了由中国计量研究院研制 的陶瓷材质的标准白板作为参比样,分别测定了它在 650 nm 和830 nm 的反射光强分布。该标准白板在这两 个波长的球面反射率分别为0 893 和0 895。考虑到由 实验装置记录的散射光强是经过光电检测器的光电转 换并经过线性放大和模数转换后的数字化量,而不是绝 对光强。本文中样品表面的散射光强由测定得到的数字 化值与参比样在相同光照条件和某一特定的检测角 (10)下测定得到的数字化值的比值表示,本文称为相 对光强 (R₂),是一个无量纲量。计算公式如下:

$$R_{s}(\boldsymbol{\theta}, \boldsymbol{\theta}) = \frac{I_{s}(\boldsymbol{\theta}, \boldsymbol{\theta})}{I_{ref}(\boldsymbol{\theta}, 10^{\circ})}$$
(1)

式中 R_s — 相对光强; I_s, I_{ref} — 分别为测试样和 参比样的散射光强的数字化值。(θ, θ)中的 θ 代表入射 角, θ 代表检测角。

图4显示了测定的标准白板在入射面上的反射光 分布图,图中显示的光强为相对光强。反射分布曲线显 示,反射角接近入射角处的曲线不连续,这是由于检测 器扫描检测过程中,光源遮挡检测器的缘故。从反射分 布曲线的形状可以看出,该标准白板反射光中既有漫反 射分量,又有方向反射分量。在入射角较小时,两个波长 的光强分布很相近;在入射角增大时830 nm 处的方向 光强略微大于650 nm 的方向光强。这是由于830 nm 波 长下的表面相对粗糙度较650 nm 下小的缘故。





因此,用标准白板作为散射光分布测定的参比时, 不能忽视标准白板的自身散射光分布特性,它并不是一 个理想的完全漫反射表面。可以考虑在较小入射角下测 定某一个确定方向的反射光作为参考光强,反映测量系 统的稳定性。

用 650 nm 波长的垂直入射光照射标准白板,在 10°20°30 检测角下分别重复200次测定反射光强,测 定间隔为5 s。图5 显示了每个测定值相对于平均值的相 对误差,统计求得10°20°30 检测角下重复测定的相对标准差分别为0 16%、0 12%和0 24%,三组重复的平均相对标准差为0 20%。





Fig 5 Relative errors of repeated reflectance intensity recordings of white board under nadir illum ination at 650 nm

3.2 大叶黄杨树叶的散射分布光强测定

在与标准白板测定完全相同的光照射条件下,测定 了大叶黄杨树叶的反射和透射分布。叶片采自中国农业 大学校园绿地生长正常的大叶黄杨树。在测定叶片散射 分布特性之前,测定了叶片在830 nm 的垂直入射光照 射下,60 检测角下的反射光强的重复性。重复测定了 200 次,测定间隔为5 s,图6显示了每个测定值相对于 平均值的相对误差,统计求到200次重复的相对标准差





图 6 在 60 检测角下重复测定大叶黄杨叶片 在 830 nm 波长光垂直照射下的反射光强相对误差

Fig 6 Relative errors of repeated reflectance recordings of an evergreen euonymus leaf at 60 °view angles under nadir illum ination at 830 nm

图 7 显示了测定大叶黄杨叶片得到的散射光分布 曲线极坐标图。比较叶片在650 nm 和830 nm 的反射分 布曲线图,可以发现它们的反射分布曲线形状差异很 大。

叶片在 650 nm 的反射光以方向反射为主, 说明其 反射光主要来自于叶片粗糙表面的反射。叶片表面反射 光会出现高光现象, 就是方向反射引起的。叶片在 650 nm 的漫反射分量极小, 说明射入叶片内部的650 nm 波 长的光基本上已被叶片内部组分如叶绿素吸收。叶片在 650 nm 处的透射光非常微弱, 也进一步说明射入叶片 内部的光基本上已被叶片吸收。



叶片在 830 nm 波长的反射光中漫反射分量比例较 大。考虑到 830 nm 的波长较 650 nm 长,在这个波长下 叶片表面相对粗糙度应小于650 nm 下的粗糙度。因此, 可以推定漫反射分量增加的主要原因不是表面反射光

© 1995-2006 Tsinghua Tongfang Optical Disc Co., Ltd. All rights reserved.

的多级散射,而是由入射到叶片内部的光被叶片内部颗 粒散射引起的。说明叶片内部组分对这个波长的光吸收 较少。叶片在830 nm 处的透射光呈现出漫透射的特征, 这也是由于射入叶片内部的一部分光被内部颗粒散射 引起的。

4 结 论

研制的测量装置可用于测定植物叶片在特征吸收 和非特征吸收波段下的反射和透射光在入射面上的光 强分布。系统可以对入射角进行两个方向独立调整和进 行 360 的检测角扫描,检测角的分辨率由进光狭缝调 整。检测波段范围为350~1100 nm,可跟据测量要求通 过更换激光管以改变光源波长。当检测角的扫描间隔为 1 时,扫描一次反射(或)透射光强分布的时间为4 2 m in。

分别用标准白板作为参比样和大叶黄杨叶片作为 被测样品,对系统的稳定性进行测试。标准白板在650 nm 垂直入射光照下,在10°20°30 检测角下重复测定 的相对标准差分别为0 16%、0 12%和0 24%,三组重 复的平均相对标准差为0 20%,说明测量系统有较好的 稳定性。由于不同检测角下的反射光强的差异,重复性 相对标准差也有较为细微的差异。虽然叶片的散射光强 较弱,其光强重复性测定相对标准差能达到1.31%。

所研制的测量装置为植物叶片的表面散射特性定 量描述提供了有效的测试手段。用传统的积分球测量方 法可以测定叶片的半球面反射率和透射率,但无法测定 各个反射和透射方向的反射光或透射光的分布。通过该 装置可测定的叶片散射光在主平面上的分布,并可以进 一步用于建立叶片表面反射和透射模型,确立双向反射 和透射分布函数,实现叶片的散射光学特征的定量化研 究,从而为植物冠层对太阳辐射能有效利用的模拟研究 提供依据。

[参考文献]

 [1] Cooper K D, Sm ith J A, Pitts D. Reflectance of a vegetation canopy using the adding method [J] App1Opt, 1982, 21(4): 4112-4118

- [2] Jacquemoud S, Baret F, Andrieu B, et al Extraction of vegetation biophysical parameters by inversion of the PROSPECT SAL models on sugar beet canopy reflectance data: Application to TM and AV IR IS sensors [J] Remote Sens Environ, 1995, 52: 163-172
- [3] Gastellu-Etchegorry J P, Demarez V, Pinel V, et al Modeling radiative transfer in heterogeneous 3-D vegetation canopies[J] Remote Sens Environ, 1996, 58: 131-156
- [4] Demarez V, Gastellu-Etchegorry J P. A modeling approach for studying forest chlorophyll content [J]. Remote Sens Environ, 2000, 71: 226-238
- [5] 郭 焱,李保国 虚拟植物的研究进展[J] 科学通报, 2001,46(4):273-280
- [6] Muhar A. Three-dimensional modeling and visualization of vegetation for landscape simulation [J] Landscape and Urban Planning, 2001, 54: 5- 17.
- [7] M yneniR, Ross J, A srar G A review on the theory of photo transport in leaf canopies [J] A gric For M eteorol, 1989, 45: 1-153
- [8] Grant L. Diffuse and specular characteristics of leaf reflectance [J] Remote Sens Environ, 1987, 22: 309-322
- [9] Ward G M easuring and modeling anisotropic reflection[J] Computer Graphics, 1992, 26(2): 265-272
- [10] Karner K F, M ayer H. and Gervautz M. An in age based measurement system for anisotropic reflection [J] Eurographics, 1996, 15(3): 119- 128
- [11] Dana K J, W ang J. Device for convenient measurement of spatially varying bidirectional reflectance [J] J Opt Soc Am, 2004, 21(1): 1- 11.
- [12] Walter-Shea EA, Noman JM, Blad BL. Leaf bidirectional reflectance and transmittance in corn and soybean
 [J] Remote Sens Environ, 1989, 29: 161-174
- [13] Torrance K E, Sparrow E M. Theory for off-specular reflection from roughened surfaces [J] J Opt Soc Am, 1967, 57: 1105- 1114
- [14] He X D. A comprehensive physical model for light reflection[J] Computer Graphics, 1991, 25(4): 175-186

Design and evaluation of a new device for measuring scattering light distribution of leaf

Lao Cailian^{1,2}, LiBaoguo¹, Guo Yan¹, Yan Tailai²

(1. Key Laboratory of Plant-Soil Interaction of M inistry of Education, College of Resources and Environmental Sciences, China A gricultural University, Beijing 100094, China; 2 College of Information and Electrical Engineering, China A gricultural University, Beijing 100094, China)

Abstract: A device for measuring bidirectional reflectance and transmittance distribution of a leaf in the plane of incidence was designed with a micro-powered laser diode for illuminating and a silicon photocell detector rotating around sample for recording scattering light intensity from the sample Illuminating by light source with wavelength of 650 nm and 830 nm, bidirectional reflectance from a white board (taken as reference) and bidirectional scattering (in reflectance and transmittance) from a leaf of evergreen euonymus (*Euonymus japonicus Thum h*) in the plane of incidence were measured separately. The results showed that the device gave good measurement reproducibility. This device can be used in the research of radiant transfer of plant canopy.

Key words: transmitted light; reflected light; scattering light distribution; leaf; radiative transfer

© 1995-2006 Tsinghua Tongfang Optical Disc Co., Ltd. All rights reserved.